

SEM-AFMによる同一箇所の座標リンケージ観察

AFM5500M

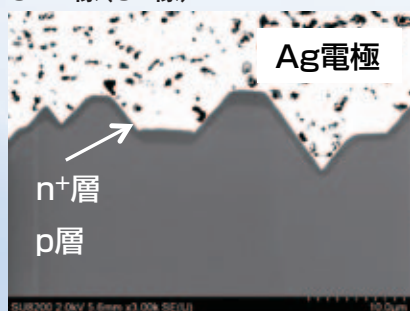
Shared- Alignment Sample Holder for SEM-AFM



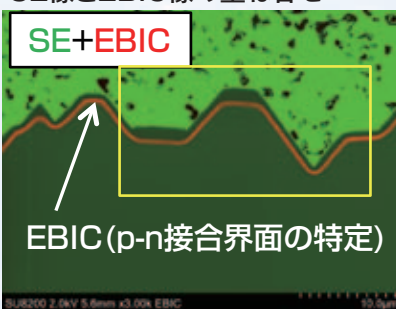
- 「S/AEMic. (セイミック)」とは、SEMによる形状、組成、元素分析などとAFMによる3D形状計測と力学物性情報や電磁気物性情報を同一箇所での手軽な解析評価を実現する、SEMとAFMのコラボレーションによる新たなソリューションです。

◎ Si系太陽電池のSEM-EBIC-AFM (電気抵抗) 観察

SEM像 (SE像)

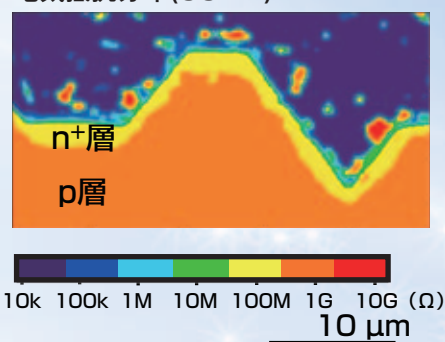


SE像とEBIC像の重ね合せ



※ EBIC (Electron Beam Induced Current)

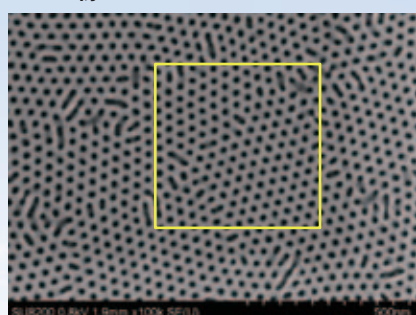
電気抵抗分布 (SSRM)



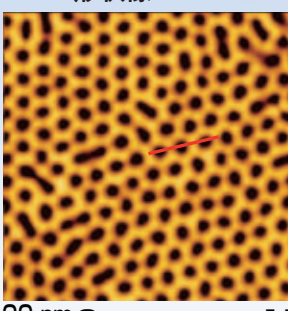
- SEM像の電位コントラストと、EBIC、AFMによる電気抵抗分布からp層、n⁺層の分布の分析が可能です。

◎ 自己組織化リソグラフィ構造のSEM-AFM観察

SEM像



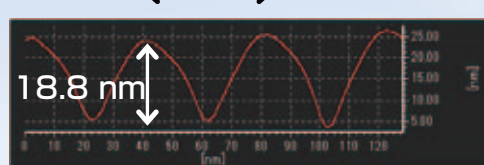
AFM形状像



100 nm 0 15 nm

断面プロファイル

40.8 nm



- 微細な類似構造の高倍率観察でもリンケージによる同視野観察が可能です。
(穴径 約20 nm、ピッチ 約40 nm)